

| 適用規格 | | | | | | | |
|---|-------------|---|--|--------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 定格 | 使用温度範囲 | -45℃～ + 125℃ (注1) | 保存温度範囲 | -10℃～ + 60℃ (注2) | | | |
| | 電圧 | AC 50 V | 適合コネクタ | DF12#(3.0) -*DS-0.5V(**) | | | |
| | 電流 | 0.3 A | | | | | |
| 性能 | | | | | | | |
| | 項目 | 試験方法 | 規格 | QT | AT | | |
| 構造 | 外観, 構造, 仕上げ | 目視, 寸法測定器にて測定する。 | 図面と合致していること。 | ○ | ○ | | |
| | 表示 | 目視にて確認する。 | | ○ | ○ | | |
| 電氣的性能 | 接触抵抗 | 100 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。 | 50 mΩ 以下 | ○ | — | | |
| | 絶縁抵抗 | DC 100 Vで測定する。 | 500 MΩ 以上 | ○ | — | | |
| | 耐電圧 | AC 150 Vの電圧を 1 分間印加する。 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | ○ | — | | |
| 機械的性能 | 総合挿抜力 | 適合コネクタで測定する。 | | ○ | — | | |
| | | | 極数 | | | 挿入力 (N) 以下 | 抜去力 (N) 以上 |
| | | | 10 | | | 19.8 | 1.5 |
| | | | 14 | | | 21.3 | 2.1 |
| | | | 20 | | | 23.4 | 2.6 |
| | | | 30 | | | 27.0 | 3.4 |
| | | | 32 | | | 27.6 | 3.6 |
| | | | 36 | | | 29.0 | 4.0 |
| | | | 40 | | | 30.6 | 4.2 |
| | | | 50 | | | 34.2 | 5.0 |
| 60 | 38.0 | 6.0 | | | | | |
| 80 | 45.0 | 7.4 | | | | | |
| | 繰り返し動作 | 50 回の抜き差しを行う。 | ①接触抵抗 : 50 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 | ○ | — | | |
| | 耐振性 | 周波数 10~55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。 | ① 1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 | ○ | — | | |
| | 耐衝撃性 | 加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。 | ① 1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 | ○ | — | | |
| 環境的性能 | 定常状態の耐湿性 | 温度 +40 ± 2℃、湿度 90~95 %中に 96 時間放置する。 | ①接触抵抗 : 50 mΩ 以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 | ○ | — | | |
| | 温度サイクル | 温度 -65 → 15~35 → 125 → 15~35℃ 時間 30 → 10~15 → 30 → 10~15分 を 5 サイクル 試験する。 | ①接触抵抗 : 50 mΩ 以下 ②絶縁抵抗 : 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。 | ○ | — | | |
| | 半田耐熱性 | 【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150~180℃ 90~120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田 (リペア) の場合 】 半田ごてで 350℃、3秒の条件にて半田付け を行う。但し、端子に力を加えないこと。 | 外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。 | ○ | — | | |
| | 二酸化硫黄 | 濃度 10ppm, 96時間放置する。 (試験規格 : JEIDA-39) | ①接触抵抗 : 50 mΩ 以下 ②はなはだしい腐食がないこと。 | ○ | — | | |
| | 塩水噴霧 | 濃度 5 %の塩水, 48 時間放置する。 | ①接触抵抗 : 50 mΩ 以下 ②はなはだしい腐食がないこと。 | ○ | — | | |
| 備考 | | | | | | | |
| (注1) 通電時の温度上昇を含みます。 | | | | | | | |
| (注2) 保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。⚠ | | | | | | | |
| | △の数 | 訂正記事 | 設計 | 検図 | 年月日 | | |
| ⚠ | 1 | DIS-H-00000882 | TR. YUNOKI | TS. MIYAZAKI | 15.09.01 | | |
| 試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。 | | | 承認 | TS. SAKATA | 04.12.20 | | |
| | | | 検図 | TS. SAKATA | 04.12.20 | | |
| | | | 担当 | AR. TAKAHASHI | 04.12.15 | | |
| | | | 製図 | YH. MICHIDA | 04.12.09 | | |
| 注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目 | | 図番 | | SLC4-163507-04 | | | |
| HRS | 製品規格表 | | 製品名 | | DF12(3.0) -*DP-0.5V(86) | | |
| | ヒロセ電機株式会社 | | 製品コード | | CL537 | | |
| | | | | | ⚠ 1/1 | | |